

迁移率（霍尔）测试仪

产品名称	迁移率（霍尔）测试仪
公司名称	九域半导体科技（苏州）有限公司
价格	2500000.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼205室（注册地址）
联系电话	13739170031

产品详情

迁移率（霍尔）测试仪产品广泛应用于半导体、光伏、科研以及平板材料测试领域。借助公司先进计量分析测试技术，为晶圆、碳化硅、硅片、氮化镓、封装测试等生产和品质监控，提供一整套完整测试和解决方案。晶圆电阻率测试仪，硅片电阻率测试仪，涡流法低电阻率分析仪，晶锭电阻率分析仪，迁移率（霍尔）测试仪，少子寿命测试仪，

技术指标	样品尺寸：2"-8"或者16mm × 16mm的方形样品； 迁移率测量范围：100-20000 (cm ² /v.sec) ； 方块电阻测量范围：100-3000 (ohm/sq) ； 载流子面密度测量范围：1E11-1E14 (cm ⁻²) ； 电磁铁磁场强度：1.0T 探头线圈直径：15mm
------	---